Исследование каскодного режима выключения интегральных тиристоров с внешним полевым управлением

© И.В. Грехов,¹ А.В. Рожков,¹ Л.С. Костина,¹ Н.Ф. Зитта ² В.И. Матвеев,² Д.В. Машовец¹

¹ Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН,

194021 Санкт-Петербург, Россия

e-mail: konst@mail.ioffe.ru

06

² Закрытое акционерное общество "Светлана-полупроводники",

(Поступило в Редакцию 27 апреля 2009 г.)

Существенным недостатком основного прибора современной силовой электроники — биполярно-полевого транзистора (IGBT) — является значительно большее, чем у приборов транзисторного типа, остаточное напряжение во включенном состоянии. Определенные перспективы применения в высоковольтных преобразователях большой мощности имеет интегральный тиристор с внешним полевым управлением, имеющий малое остаточное напряжение, как у обычного тиристора, и одновременно малые затраты энергии в цепи управления при включении и выключении, как у IGBT. Проведены исследования процесса выключения этих приборов в каскодном режиме с последовательно соединенным низковольтным мощным полевым транзистором.

Введение

Наиболее широко используемым полупроводниковым прибором для преобразования электроэнергии в области мощностей от единиц до тысяч киловатт в настоящее время является биполярно-полевой транзистор (IGBT -Insulated Gate Bipolar Transistor), полупроводниковый чип которого состоит из нескольких сотен тысяч элементарных ячеек с характерным размером 5-10 µm, каждая из которых представляет собой высоковольтный биполярный транзистор с полевым транзистором в цепи управления. IGBT имеет высокое быстродействие при включении и выключении и очень малые затраты энергии в цепи управления, однако остаточное напряжение во включенном состоянии у этих приборов существенно выше, чем у обычных тиристоров, особенно для приборов с большими рабочими напряжениями. Предполагалось, что альтренативой IGBT может стать интегральный тиристор с полевым управлением (МСТ — MOS Controlled Thyristor), элементарная ячейка которого представляет собой высоковольтный микротиристор, в цепь управления которого включен полевой микротранзистор; для выключения прибора проводящий канал транзистора замыкает накоротко цепь эмиттербаза микротиристора, прерывая тем самым инжекцию электронов со стороны управляемого n^+p -эмиттера.

Эквивалентная схема элементарной ячейки МСТ приведена на рис. 1, а. В течение ряда лет несколько крупных фирм, в основном в США, вели разработки приборов этого типа, но значительная технологическая сложность изготовления и сильная конкуренция со стороны IGBT привели к тому, что сейчас эти тиристоры производятся в очень малых масштабах и в основном для импульсной техники [1]. По нашему мнению, для преобразовательной техники определенные перспективы, особенно в области высоких рабочих напряжений, имеет описанный авторами ранее высоковольтный быстродействующий интегральный тиристор с внешним полевым управлением [2,3] и др., силовой чип которого состоит из микротиристорных ячеек, выключаемых одним общим низковольтным мощным полевым транзистором (рис. 1, b).

Как было показано в [3], микротиристорный чип размером 9 × 9 mm с напряжением переключения 2.5 kV способен выключать ток в 100 A в режиме короткого замыкания цепи эмиттер–база полевым транзистором с сопротивлением канала $\sim 1 \cdot 10^{-2} \Omega$, причем динамические характеристики процесса были вполне сопоставимы с характеристиками IGBT, рассчитанными на аналогичное рабочее напряжение. Принципиальной осо-



Рис. 1. Эквивалентная схема MOS Controlled Thyristor (a) и конструкция интегрального высоковольтного тиристора (b).

¹⁹⁴¹⁵⁶ Санкт-Петербург, Россия

бенностью конструкции прибора является очень малое сопротивление в цепи управления, поскольку падение напряжения, создаваемое при выключении протеканием всего силового тока тангенциально по *p*-базе под n^+ -эмиттером и далее через канал полевого транзистора в силовую цепь, не должно превышать порога начала инжекции из n^+p -эмиттера (~ 0.6 V).

Исследование процесса выключения интегрального тиристора в каскодном режиме

Типичные осциллограмы процесса выключения интегрального тиристора с внешним полевым управлением в обычном режиме приведены на рис. 2. Исследуемый чип размером 9×9 mm (активная площадь 7×7 mm) с блокируемым напряжением 2.5 kV состоял из 10^4 ячеек микротиристоров с размером ячейки $12 \times 15 \mu$ m. Шунтировка цепи эмиттер–база осуществлялась чипом полевого транзистора КП-742Б с сопротивлением канала $\sim 7 \text{ m}\Omega$ и рабочим напряжением 30 V (Объединение "Интеграл", Минск) либо экспериментальным чипом разработки ЗАО ВЗПП-Микрон (Воронеж) с сопротивлением канала $\sim 10-20 \text{ m}\Omega$ и рабочим напряже-



Рис. 2. Токовые осциллограммы в режиме запирания тиристора путем шунтирования эмиттерного *pn*-перехода внешним полевым транзистором. Коэффициент развертки вертикального отклонения –10 (*a*), –20 (*b*) А/div; коэффициент развертки горизонтального отклонения — 500 ns/div.



Рис. 3. Эквивалентная схема каскодного включения высоковольтного интегрального тиристора и МОП-транзисторов.

нием 60 V; тиристорый и транзисторный чипы монтировались на общей подложке из металлизированной AIN-керамики.

На осциллограмме (рис. 2, a) хорошо видно, что при подаче включающего импульса напряжения на транзисторный чип после небольшой задержки ($\sim 0.6 \, \mu s$) происходит резкий спад тока с 50 до 10 A за 300 ns, после чего процесс переходит в медленную стадию ("хвост"), длящуюся ~ 1.5 µs и определяемую количеством электронно-дырочной плазмы, остающейся у анодного эмиттера после восстановления блокирующей способности коллекторного перехода микротиристоров. При увеличении выключаемого тока до ~ 100 А (плотность тока $\sim 200 \,\text{A/cm}^2$, что примерно вдвое больше, чем у аналогичных IGBT) крутизна спада тока существенно уменьшается (рис. 2, b). При дальнейшем увеличении тока выключение становится невозможным. Это связано, по-видимому, с тем, что падение напряжения, создаваемое протекающим силовым током на сопротивлении цепи эмиттер-база, уже превышает порог начала инжекции электронов катодным *n*⁺-эмиттером.

Параметры процесса выключения интегрального тиристора резко улучшаются в так называемой каскодной схеме [4], когда последовательно с ним в катодную цепь включается низковольтный сильноточный полевой транзистор T_2 с малым сопротивлением канала (рис. 3). Этот транзистор находится во включенном состоянии в течение всего времени протекания силового тока и должен быть выключен несколько позже включения транзистора T_1 , осуществляющего короткое замыкание цепи эмиттер-база интегрального тиристора. После этого процесс инжекции электронов из катодного n^+ -эмиттера становится принципиально невозможным, и предельная величина выключаемого тока будет определяться явлениями, связанными с появлением больших электриче-



Рис. 4. Токовые осциллограммы на этапе выключения тиристора в режиме каскодной схемы включения. Коэффициент развертки вертикального отклонения -20 A/div, горизонтального — 500 ns/div. $\Delta T = 0.5$ (*a*), 1.2 (*b*) μ s.

ских полей в плотном потоке дырок, выводимых по цепи управления [5].

Типичные осциллограммы процесса выключения в каскодной схеме при выключаемом токе ~ 100 А приведены на рис. 4. На рис. 4, *а* транзистор T_2 был включен через $\Delta T = 0.5 \,\mu$ s после включения транзистора T_1 , т.е. практически сразу после начала спада тока. Хорошо видно, что прерывание инжкеции n^+p -эмиттера приводит к резкому ускорению спада тока (~ 100 ns вместо 1.2 μ s на рис. 2, *b*). Однако это не повлияло на поведение "хвоста" тока, который имеет такой же вид, как и на рис. 2, *a*. Если включение транзистора T_2 производится с большей задержкой ($\Delta T = 1.2 \,\mu$ s, рис. 4, *b*), то начальный участок выключения протекает довольно медленно, аналогично рис. 2, *b*, а после включения T_2 резко ускоряется.

Из приведенных на рис. 2, 4 осциллограмм следует, что рассматриваемый процесс выключения состоит из двух почти независимых процессов, протекающих параллельно: быстрый спад основной части тока, определяемый процессами в тонкобазовом быстром n^+pN транзисторе, и медленный "хвост", определяемый только релаксацией электронно-дырочной плазмы, накопленной в толстой *N*-базе у p^+N -эмиттера во время протекания прямого тока. Первый процесс может быть существенно ускорен путем каскадного включения полевого транзистора T_2 в силовую цепь у катодного эмиттера, а для ускорения второго процесса необходимо либо уменьшение коэффициента инжекции p^+N эмиттера (так называемый "прозрачный" эмиттер), либо локальное уменьшение времени жизни носителей в Nбазе у p^+N -эмиттера.

На рис. 5 приведены зависимости времени резкого спада тока от его начальной амплитуды для обычного и каскодного режимов выключения; хорошо видно, насколько сильно затягивает этот процесс инжекция электронов из n^+p -эмиттера в обычном режиме выключения при больших токах.

На рис. 6 приведены зависимости времени резкого спада тока от времени задержки ΔT между включением транзистора T_1 и выключением транзистора T_2 при выключении тока в 100 А. Минимальное время спада (~ 100 ns) соответствует выключению T_2 в мо-



Рис. 5. Зависимости времени спада от амплитуды выключаемого тока для двух режимов запирания высоковольтного интегрального тиристора: ■ — при шунтировании эмиттерного *pn*перехода внешним полевым транзистором; ◆ — при каскодном включении.



Рис. 6. Зависимость времени спада тока от времени задержки (ΔT) выключения полевого транзистора в силовой цепи относительно включения полевого транзистора, шунтирующего эмиттерный *pn*-переход интегрального тиристора.

мент начала спада тока, а при длительности задержки более 1.5 µs соответствует времени спада в обычном режиме. Таким образом, в каскодном режиме появляется возможность точной синхронизации процесса параллельного включения большого числа тиристорных чипов путем установки соответствующего времени задержки выключения транзистора Т₂ каждого тиристорного чипа. Возможность быстрого выключения больших токов (рис. 5) позволяет, в принципе, создать эффективную защиту от импульсных перегрузок по току, а малые коммутационные потери при выключении позволяют существенно увеличить предельную рабочую частоту. Конечно, введение дополнительного элемента — полевого транзистора — в силовую цепь увеличивает суммарные потери при протекании прямого тока. Так, в описанных экспериментах при токе в 100 А падение напряжения на транзисторе КП-742Б составляло 0.7 V, а на тиристороном чипе ~ 2.5 V, т.е. потери возрастают на ~ 28%. Однако коммутационные потери при выключении снижаются примерно на порядок, и при работе на повышенных частотах каскодное включение может быть экономически оправданным. Кроме того, с ростом рабочего напряжения тиристорного чипа остаточное напряжение на нем возрастает, и относительная доля потерь в транзисторе T_2 снижается.

Заключение

Интегральный тиристор с внешним полевым управлением имеет малое остаточное напряжение во включенном состоянии, как у обычного тиристора, малые затраты энергии в цепи управления при включении и выключении, как у IGBT, и сравнимое с этим прибором быстродействие. Принципиальной особенностью конструкции полупроводниковой структуры интегрального тиристора является очень малое сопротивление в цепи управления, поскольку падение напряжения, создаваемое в этой цепи в процессе выключения протеканием всего силового тока, не должно превышать порога начала инжекции из $n^+ p$ -эмиттера (~ 0.6 V). Это существенно ограничивает предельную величину выключаемого тока. Кроме того, при приближении к порогу инжекции длительность процесса выключения возрастает и растут коммутационные потери.

Проведенные исследования показали, что при выключении в каскодном режиме с последовательно соединенным низковольтным мощным полевым транзистором, который выключается одновременно с началом спада тока в силовой цепи, предельный выключаемый интегральным тиристором ток существенно возрастает, примерно на порядок уменьшается время спада тока и соответственно снижаются коммутационные потери. Эти преимущества особенно существенны при работе на повышенных частотах и для высоковольтных приборов с относительно большим остаточным напряжением (3-4 V), когда относительная величина дополнительного падения напряжения на последовательно включенном низковольтном полевом транзисторе ($\sim 0.7 \, \mathrm{V}$) уменьшается.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований ОЭММПУ РАН "Физикотехнические проблемы полупроводниковой электроники больших мощностей".

Список литературы

- [1] Temple V.A.K. // Proc. European Pulse Power Symp. Saint Louis, France, 2002. P. 19/1-19/3.
- [2] Грехов И.В., Мнацаканов Т.Т., Юрков С.Н., Тандоев А.Г., Костина Л.С. // ЖТФ. 2006. Т. 76. Вып. 5. С. 76-81.
- [3] Грехов И.В., Костина Л.С., Рожков А.В., Зитта Н.Ф., Матвеев В.И. // ЖТФ. 2008. Т. 78. Вып. 12. С. 78-85.
- Бономорский О.И., Воронин П.А. // Энергетическая (Сило-[4] вая) электроника. 2002. № 6. С. 18-22.
- Горбатюк А.В., Грехов И.В. // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 10. C. 80.

158